Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)

Charge Carrier Dynamics and Mobility Measurement In Conjugated Polymer Using In-Situ TRMC-TAS

A. Saeki^{1,A)}, S. Seki^{A)}, Y. Koizumi^{A)}, T. Sunagawa^{B)}, A. Anjali^{A)}, K. Ushida^{C)}, and S. Tagawa^{A)}

^{A)} The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567-0047

^{B)} Fukui University of Technology

3-6-1 Gakuen, Fukui, Fukui 910-8505

^{C)} RIKEN (Institute of Physical and Chemical Research)

2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0106

Abstract

Using in-situ TRMC-TAS (time-resolved microwave conductivity- time-resolved absorption spectroscopy), the dynamics of photo-generated charge carriers and their conductivity in a conjugated polymer was investigated.

In-Situ TRMC-TASによる共役系高分子中での 移動度測定・電荷キャリアダイナミクス

1.はじめに

誘電体中をマイクロ波が通過すると、双極子モー メントとの相互作用により、マイクロ波の吸収(誘 電吸収)と位相のずれが生じる^[1]。誘電吸収は、分 子の回転のエネルギーに相当し、定常状態で双極子 モーメントを持つ分子の回転運動を誘起する。この 性質は、励起光や入射放射線によって生じるプラス とマイナスのイオン種対についても同様で、この誘 電吸収を測定することでイオン対の双極子モーメン トを観測することができる。また、チャープした光 を用いることで、ラジカル種の誘電吸収を測定した 例も過去に報告されている。

空洞共振器(Cavity)とパルスレーザーを用いる ことで高感度で誘電吸収の時間挙動を測定できるよ うになった。このようにマイクロ波を使った時間分 解誘電吸収測定は、Time-Resolved Microwave Conductivity(TRMC)と呼ばれる(図1)。この方 法を使って、励起三重項状態・励起一重項状態・ラ ジカル・CT状態などの双極子モーメントが測定さ れてきた。TRMCでは、通常の光吸収分光では測定 できない極性の変化を直接測定できるという特徴が あり、過渡種の時間的挙動や構造に対する情報を与 えることができる。

ナノテクノロジーで対象とされる構造物は、トッ プダウン・ボトムアップのいずれの方法にしても、 分子一つのサイズを1つの目標としている。例えば、 将来の半導体デバイス材料として、カーボンナノ チューブを配線や基本素子に用いるといった研究が なされているが、このような状況下では、分子1つ の伝導度の評価することが重要な意味を持つ。微細 加工技術を用いて作製したギャップに、分子1本 (複数本の場合は、SEM等で直接観察し、分子1つ あたりの伝導度を算出する)を橋渡しして電流-電 圧特性を測定することができるが、電極とのコンタ クトの問題などがあり、分子1本に固有な値を得ら れるかどうかは試料の製作法・条件・確率的要因に 依存している。また、TOF法での伝導度測定では、 ピンホールのないフィルムを用意する必要があり、 複数の材料での比較には、十分に注意する必要があ る。

一方、TRMCは電極を作製することなしに、バル クの固体・溶液中で伝導度を測定することが可能で ある。



¹ E-mail: saeki-a@sanken.osaka-u.ac.jp

Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)



図2: In-situ TRMC-TAS 測定システム

2.マイクロ波立体回路

図2にIn-situ TRMC-TAS測定系を示す。TASは Transient Absorption Spectroscopy (光過渡吸収分光)で あり、活性種の電子準位をプロープする方法である。 マイクロ波回路(マイクロ電子製)はX-band周波数 帯のもので、Gunn Oscillatorから発振されるマイク ロ波はメインアームとバイアスアームへと分けられ る。メインアームを通るマイクロ波はCirculatorを経 て、サンプルセルが装着されたCavity(空洞共振 器)内に入射される。入射マイクロ波電力はメイン アーム中のAttenuatorにより約3mWに調整されてい る。Cavityからの反射信号はCirculatorを経てFET Amp.で増幅された後、バイアスアームからの電力 と合流し検波される。

マイクロ波Cavityにはある特定の周波数(共振周 波数)のマイクロ波を閉じ込めて反射波を出さない ようにする性質があり、マイクロ波の周波数が共振 周波数からずれたり、空洞共振器内でエネルギー吸 収(損失)が起こる(すなわちQ値が減少する)と、 空洞共振器からマイクロ波の反射波が生ずる。この 現象を模式的に図2に示した。Q値は次式で定義さ れる。

$$Q_0 = f_0 / \Delta f_0 \qquad (1)$$

CavityのQ値の変分のみを測定するためにバイア ス波の位相波は反射波のそれと同位相になるように 設定される。共振周波数シフトの変分を測定するた めにはバイアス波の位相波は反射波のそれとπ/2だ けずれるように設定される。

以上述べたように、メインアーム・バイアスアー ムからなるこの立体回路はホモダイン方式である。 また、バイアスアームに導かれたマイクロ波の一部 は、さらにAFC (Automatic Frequency Controller)へ 送られる。Gunn Oscillator AFC Arm AFC unit Gunn Oscillatorの閉ループは発振周波数の長時間安 定性を保つフィードバックの役割を果たす。ただ、 現在のところAFCの調整には実験上の不都合があり、 また、誘電吸収測定は1パルスで行われ、活性種の 時間挙動も1ms程度以内でベースラインに戻るもの がほとんどなので、今のところAFCは使用していな い。

3.解析手法

反射マイクロ波の変化分(ΔP)と伝導度の変化分 (Δσ)には、その変化量が微小であれば比例関係が成 りたつ。さらに、サンプルの形状・空洞共振器の形 状(電場)を考慮することによって、TRMCシグナ ルは、次式のように変換される。

$$\phi \sum \mu = \frac{\pi f_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r}{\mp Q(1/\sqrt{R_0} \pm 1)} \cdot \frac{1}{e \cdot I_0 \cdot F_{Light}} \cdot \frac{\Delta P_r}{P_r} \qquad (2)$$

ここで、φ: 入射レーザーの電荷キャリア生成量子 収率、Σμ: 電荷キャリアの移動度の和、f0:共振周波 数、ξ:空洞共振器内の比誘電率、Q:空洞共振器のQ 値、R₀:=Pr/Pi 反射マイクロ波・入射マイクロ波の パワー比、I₀:入射フォトン密度、F_{light}:空洞共振器・ サンプルによって決まるcorrection factorである。式 (2)の左辺は、すべて実験と計算で求められる値で あり、この式を用いて変換されたTRMCシグナルの 縦軸は、量子効率(無次元)と移動度(cm²/Vs)を かけたもの、すなわち移動度と同じ単位となる。



図3: 空洞共振器内での電場分布

図3に用いた空洞共振器の電場計算の結果を示す。 この電場分布は、Flightを計算するときに用いられる。

4. 共役系高分子での測定

図4に、regioregular poly 3-hexyl thiophene (RR-P3HT)をサンプルとして用い、得られたTRMCシグ ナルを示す。RR-P3HTなどの 共役系高分子は、将 来の有機EL素子として期待されている材料の一つ である。 TRMCシグナルは、図に示すように4種類の励起波 長のレーザーを照射することで得られた。それぞれ 高いエネルギーから、ArF excimer, KrF excimer, THG of Nd:YAG, SHG of Nd:YAGである。RR-P3HTのイ オン化ポテンシャルは5.4eV、バンドギャップエネ ルギーは、2.2eVと報告されており、今回得られた TRMCシグナルは、これらの値と合致している。イ オン化ポテンシャルより高いエネルギーである 6.39eV励起では、速い減衰と遅い減衰が観測され、 バンドギャップより高くイオン化ポテンシャル以下 の他の3つの励起では、遅い減衰のみが観測された。 イオン化ポテンシャルより高い励起の場合は、電荷 キャリアがパルス内で生成し、かつその量子効率は 他の励起波長より高い。生成した電荷キャリアは電 荷再結合によって消えていく。その後、高分子中に 存在する不純物・構造欠陥でのトラップ、電荷再結 合によってシグナルは減衰し、これが遅い減衰とし て観測される。イオン化ポテンシャル以下の励起の 場合、伝導体に励起された状態(エキシトン状態) では電荷キャリアとしては働かないが、このエキシ トンは、高分子中での構造不正などのサイトでエキ シトン解離を起こし、電荷キャリアが生成すると考 えられる。



図4: RR-P3HTでのTRMCシグナル

参考文献

[1] (a)P. P. Infelta, M. P. de Haas, J. M. Warman, *Radiat. Phys. Chem.* 10, 353 (1977). (b) M. P. de Haas, and J. M. Warman, *Chem. Phys.* 73, 35 (1982). (c)A.Saeki et al., submitted. (d) A.Saeki, et al., "リニアック技術研究会論文 Proceedings of the 28th Linear Accelerator Meeting in Japan, Ibaraki, 2003.